

增刊

τ 轻子 Michel 参数测量中的电子识别方法

钱诚德,冯胜,童国梁¹,吴义根¹

上海交通大学应用物理系 上海 200030)

(1 中国科学院高能物理研究所 北京 100039

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 北京谱仪(BES)合作组通过 $\tau \rightarrow e\nu\nu$ 衰变的电子能谱测定 Michel 参数,本文利用 BES 在质心系能量 4.03 GeV 处获取的 e^+e^- 对撞数据,通过 BES 给出的带电粒子 dE/dx 、 β 、 E/p 测定值及其适当组合,实现了电子的有效识别.

关键词 [Michel 参数](#) [\$\tau\$ 轻子衰变](#) [电子识别](#) [两维散点图](#)

分类号

DOI:

通讯作者:

钱诚德

作者个人主页: [钱诚德](#); [冯胜](#); [童国梁¹](#); [吴义根¹](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(221KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“Michel 参数”的 相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)

· [钱诚德](#)

· [冯胜](#)

· [童国梁](#)

· [吴义根](#)